

Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0493U000788

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 08-02-2000

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:



II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Субота Юрий Васильевич

2. Субота Юрий Васильевич

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: dashboard/okd.okd_type_names.0

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 05.27.06

Назва наукової спеціальності: Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 16-04-1993

Спеціальність за освітою: 2302

Місце роботи здобувача: Інститут фізики напівпровідників НАН України

Код за ЄДРПОУ: 5416955

Місцезнаходження: 252650 г.Київ-28, пр.Науки, 45

Форма власності:

Сфера управління: НАН України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 016.25.01

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Інститут фізики напівпровідників НАН України

Код за ЄДРПОУ: 5416955

Місцезнаходження: 252650 г.Київ-28, пр.Науки, 45

Форма власності:

Сфера управління: НАН України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 47.33.31, 47.09.29

Тема дисертації:

1. Методы лазерного сканирующего контроля дефектности поверхности кремниевых пластин
- 2.

Реферат:

1. Объект исследования: Микродефекты и модельные объекты в виде латексных шариков на поверхности кремниевых пластин. Цель исследования: Решение комплекса научно-технических проблем по созданию методов лазерного сканирующего контроля поверхности полупроводниковых пластин и внедрению их в промышленный технологический процесс. Методы исследования и аппаратура: Измерение индикатрис рассеивания света, измерение интегрального коэффициента рассеивания света, электронная микроскопия. Теоретические результаты и новизна: Показано, что зависимость интегрального сечения рассеивания света латексных шариков на поверхности полупроводника от диаметра шарика представляет собой кривую с минимумом в области 0,65–0,7 мкм. Использование соотношения интенсивностей рассеянного микрочастицами света при освещении их двумя лучами с разными длинами волн. Практические результаты и новизна: Установлено, что критерием состояния технологического оборудования с точки зрения уменьшения внесенной дефектности с положения максимума на кривой статистического распределения количества микродефектов на пластинах. Предмет и степень внедрения: Внедрено установки контроля

кремниевых пластин в ВО "Квазар" "Киев/ и ПО "Элекс" /Александров/. Эффективность внедрения: Суммарный экономический эффект составляет 160,9 тыс. р. в год. Сфера (область) использования: Контроль состояния поверхности полупроводниковых пластин в ПО "Квазар", "Сатурн", "Орион", "Родон" и др.

2.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ширшов Ю.М.

2. Ширшов Ю.М.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10, 1

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Стергилов В.А.

2. Стергилов В.А.

Кваліфікація: к.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Жарких Ю.С.

2. Жарких Ю.С.

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Конакова Р.В.

2. Конакова Р.В.

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.01, 1

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. **Заключні відомості**

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
голови ради**

Шейнкман М.К.

**Власне Прізвище Ім'я По-батькові
головуючого на засіданні**

Шейнкман М.К.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**



Юрченко Т.А.